

SR10-FF 2D分光放射計対応膜厚ソフト

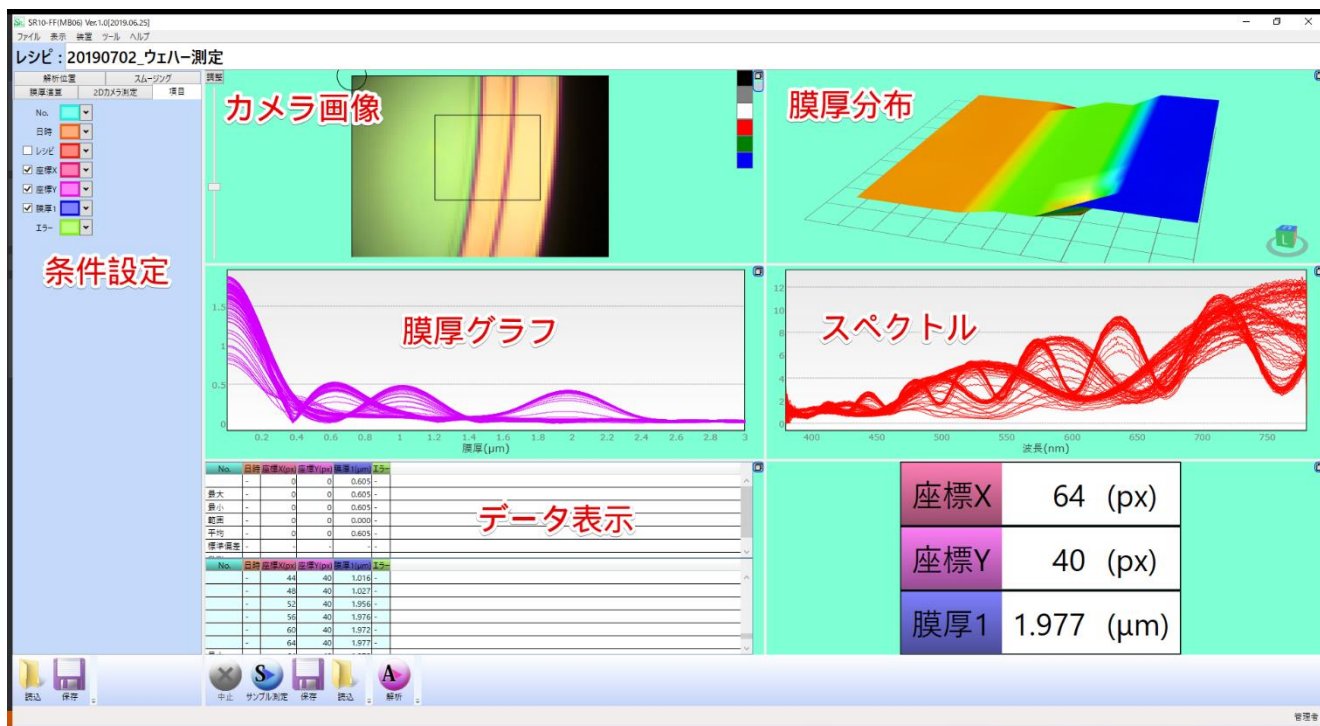
■ 概要

SR-5000/SR-5100 による測定データを読み込み、膜厚演算や解析などを行うソフトウェアです。

■ 測定範囲

標準仕様	0.5 μ m ~ 15 μ m (0.001 μ m)
標準 + 薄膜解析	0.01 μ m ~ 15 μ m (0.001 μ m、0.1nm)

■ ソフトウェア画面例



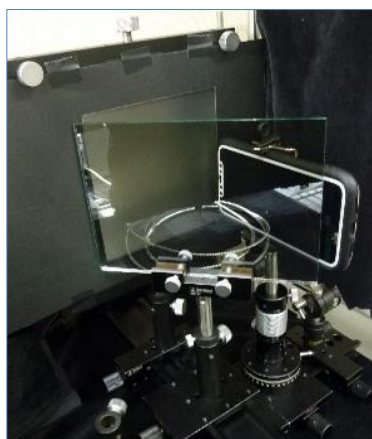
条件設定	膜層の屈折率等を設定します
カメラ画像	測定画像等を表示します
膜厚分布	膜厚分布を 3D 表示します
膜厚グラフ	膜厚をグラフ表示します
スペクトル	指定位置のスペクトルを表示します
データ表示	各種データ詳細を表示します

保存	データを CSV 等で保存できます
読込	SR-5100 の測定データを読み込みます
解析	読み込まれた測定データを解析し、膜厚分布演算を行います。



型式	品名	備考
SR10-FF	2D 膜厚解析ソフト	
SR10-FF-2D	標準 2D 仕様	0.5~15 μ mの FFT 膜厚測定。
OP-ML	オプション：多層膜対応	標準 FFT では 1~3 層、カーブフィット法では 1~10 層。
OP-QC	オプション： QC 対応（測定・解析・判定）	トプコンテクノハウス製のレシピファイルを登録し 測定・解析・判定を行う事が出来ます。
OP-FIT	オプション： カーブフィット解析+多層膜	0.01~15 μ mの膜厚測定。 シミュレーション機能搭載。 オプション多層膜解析含みます。
OP-MI	オプション：顕微対応	バックグランド補正。NA 補正。
OP-MA	オプション：他国言語対応	初期値には英語が入っています。 別言語をお客様が入力可能です。
SR10-FF	2D 膜厚ハードウェア	
BOX-1	2D 膜厚マクロ測定 BOX	サンプル台（100mm角）・反射光学系・光源・暗箱など。

■ ハードウェア例

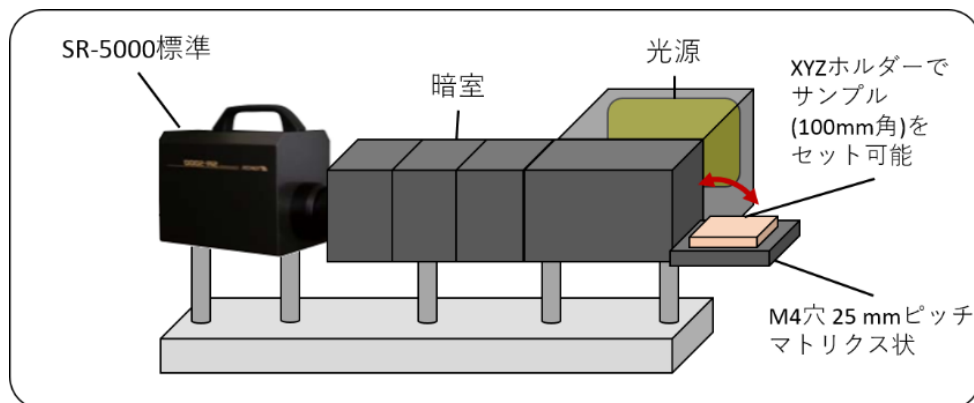


標準レンズ使用例



SR5000HM+顕微鏡 活用例

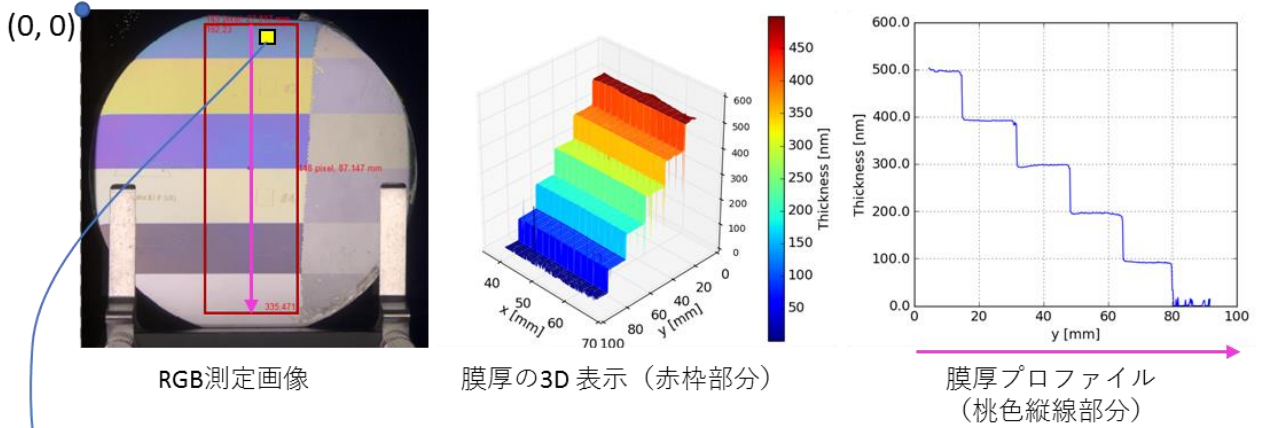
■ 2D 膜厚マクロ測定 BOX



■ 測定例

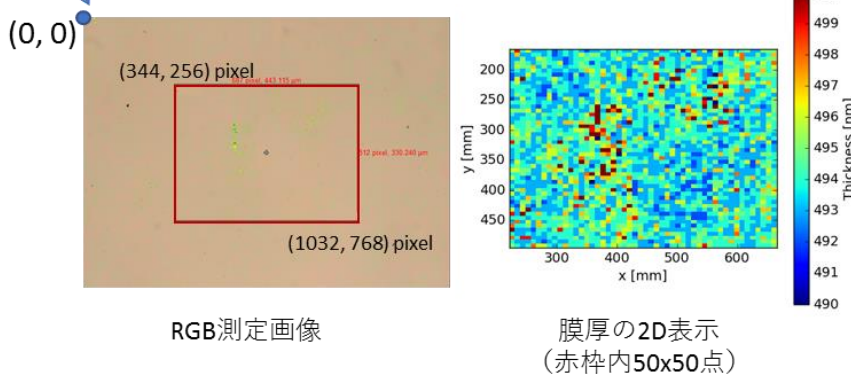
SiO₂薄膜の厚み測定（標準測定）

空間分解能：0.195 mm



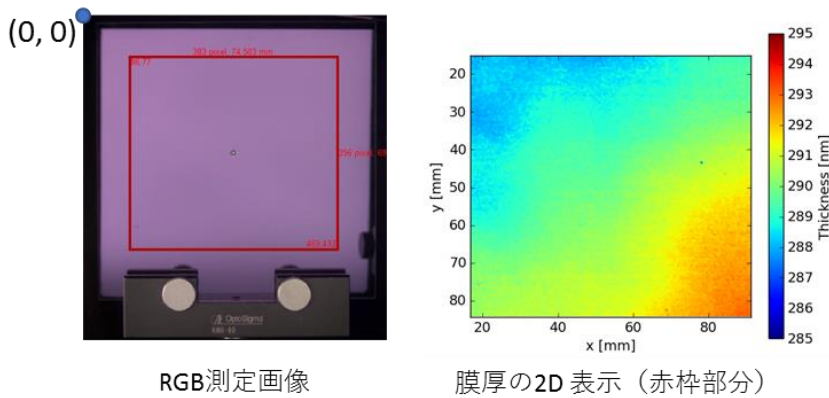
SiO₂薄膜の厚み測定（顕微測定）

空間分解能：0.645 μm
（x10倍対物レンズ使用時）



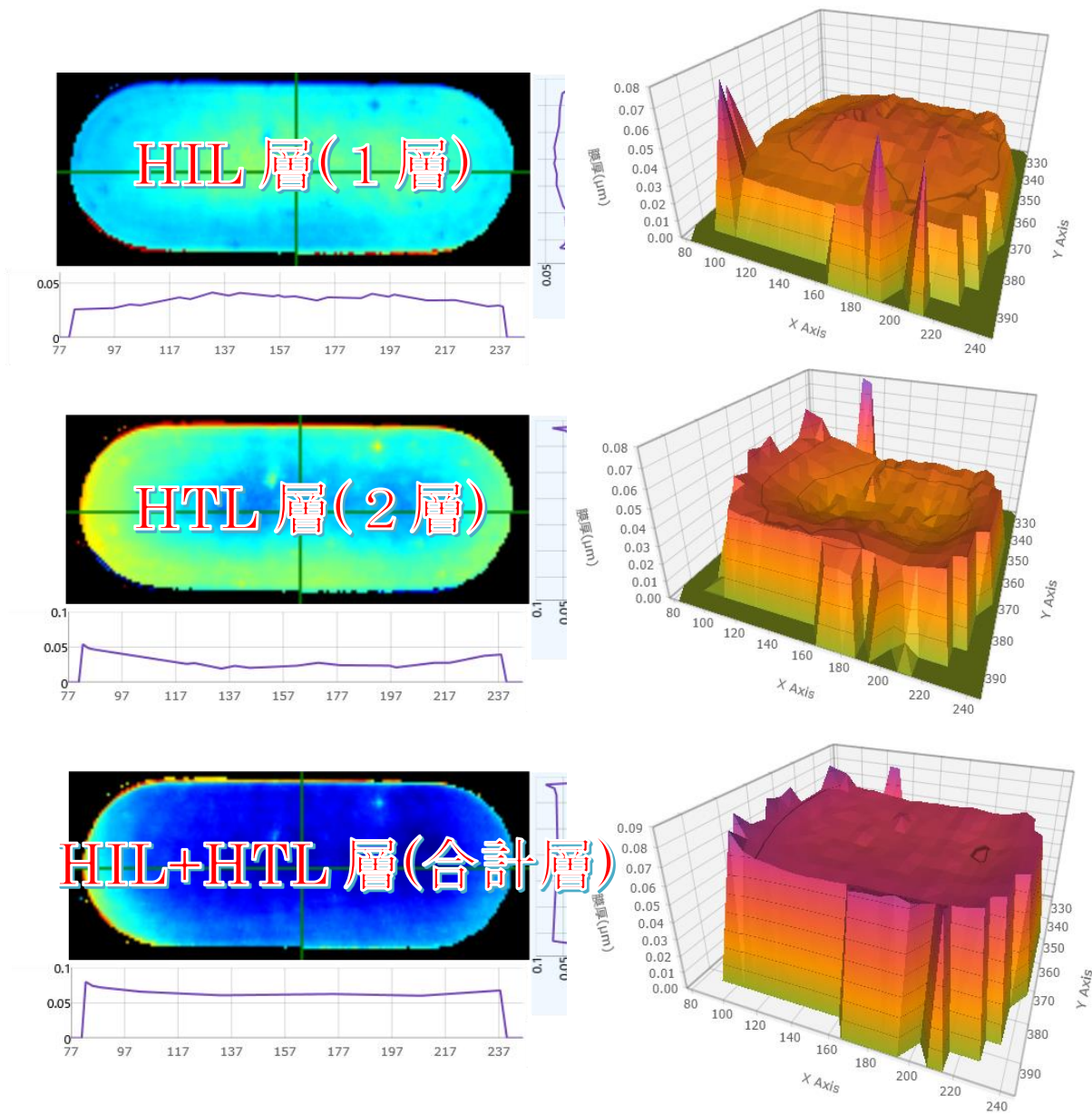
ITO薄膜の厚み測定（標準測定）

空間分解能：0.195 mm



■ 測定例

有機 EL の HIL の上に HTL を重ねてある 2 層を同時測定。



注 1 : SR-5000/SR5100 本体およびパソコンは含みません。

注 2 : 発送、納品作業は含みません。

注 : 仕様・価格は改善等の為、予告無く変更する場合があります。



開発・製造・販売元：株式会社システムロード
 〒604-8475 京都市中京区西ノ京中御門西町22
 TEL : 075-811-1031 FAX : 075-811-8360
 URL : <http://www.systemroad.co.jp>